

Сканирующий зондовый микроскоп NTegra

Производитель: ООО Эмтион, Россия

Исследование морфологии поверхности различных твердых материалов методами сканирующей зондовой микроскопии.

Основные характеристики:

- поле сканирования - 100x100x10 мкм
- уровень шума по оси Z - не более 0.04 нм, уровень шума по осям X,Y - не более 0.2 нм
- методики: контактная/полуконтактная атомно-силовая микроскопия, модуляция силы, изображение адгезионных сил, латеральная силовая микроскопия, пьезоэлектрический отклик, емкостная микроскопия, метод зонда Кельвина, магнитно-силовая, электростатическая микроскопия, литография, прыжковая атомно-силовая микроскопия.

Ответственный за оборудование: Виктория Андреевна Тимофеева, лаборатория 1637

Проведение исследований на образцах других лабораторий: да